



Toulouse, 10 mai 2006

Communiqué de Presse

1^{re} édition européenne du Congrès scientifique EOS/ESD/EMI à l'IAS de Toulouse les 18 et 19 mai prochains

Le LAAS-CNRS et le CNES co-organisent les 18 et 19 mai 2006 la 3^e édition d'un congrès sur la fiabilité électronique des systèmes qui réunit les communautés scientifiques et industrielles des deux grands domaines de recherche EOS/ESD (Immunity of electronic applications to electrical stresses) et EMI (Immunity of electronic applications to electromagnetic stresses).

Initié en 2002 à l'initiative de Marise Bafleur, directrice de recherche au LAAS-CNRS, ce congrès national rassemblait au départ une petite communauté de spécialistes des systèmes électroniques.

Les dernières années ont vu une croissance très rapide de tels systèmes dont la miniaturisation à l'échelle nanométrique et la complexification, avec l'apparition des MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems) contraignent de plus en plus le fonctionnement.

D'ores et déjà les MEMS ont fait leur apparition dans notre quotidien qu'il s'agisse de nos airbags ou tout simplement de nos imprimantes à jet d'encre et la généralisation des systèmes embarqués avec l'accroissement des contraintes de sécurité qui en découle lance un défi important aux communautés scientifiques impliquées aussi bien dans les domaines de la protection électronique que dans celui de l'électromagnétique.

En s'ouvrant, pour la première fois, à la communauté européenne le congrès EOS/ESD/EMI accueillera des intervenants allemands, belges, italiens et suisses qui rythmeront les deux journées de rencontres au cours desquelles de fructueuses interactions entre monde académique et industriel sont attendues.

Le congrès se déroulera à l'Institut Aéronautique et Spatial de Toulouse (IAS) et attend une centaine de participants.

Il est à noter qu'un intervenant industriel américain sera également invité à tenir une session, préfigurant peut-être de l'éventuelle ouverture internationale du congrès dans les années à venir.

Le congrès est gratuit grâce au soutien qu'il a reçu des CCT du CNES, du LAAS-CNRS, de l'UPS, de MB Electronique, d'Oryx Instruments Corp. et de la Région Midi-Pyrénées.

Contacts scientifiques : Marise Bafleur, bafleur@laas.fr ; Philippe Perdu, philippe.perdu@cnes.fr

Renseignements complémentaires : <http://www2.laas.fr/EOS-ESD-EMI/>

Contact Presse LAAS-CNRS : Delphine Maillet-Mongeau

dmaillet@laas.fr, 05 61 33 78 87 / 06 84 59 57 50 / Web : <http://www.laas.fr>